

産業標準案作成対象テーマの審議について

日本産業規格（JIS）の制定、改正又は廃止のための産業標準案（以下、JIS 案という。）の作成に着手するに当たっては、当会認定産業標準作成機関 JIS 案作成規程に基づき、当該 JIS 案作成対象テーマが適切であることについて、主務大臣による事前調査、及び JSA 事務局による“JIS 案の作成開始要件”を満たすことの事前確認を経て、産業標準作成委員会にお諮りすることとなっております。

つきましては、次ページ以降の JIS 案作成対象テーマについて、理由（必要性）及び期待効果、JIS 案の作成開始要件への適合状況、作成開始予定などを記載しておりますので、JIS 案の作成に着手してよろしいかご審議をお願いいたします。また、産業標準作成委員会の下に JIS 素案の調査審議及び作成を行うための WG を設置することについても併せてご審議をお願いいたします。

なお、字句等編集上の修正については、産業標準作成委員会事務局に一任いただきますようお願いいたします。また、ご承認いただいた JIS 案作成対象テーマは、利害関係者に公表するために JIS 作成予定一覧表として JSA ウェブサイト掲載いたします。

※選定基準 3（産業標準化の利点・欠点）各コードの内容につきましては、
下記リンク先の 5～6 ページにてご確認いただけます。

「産業標準案等審議・審査ガイドライン」

URL <https://www.jisc.go.jp/jis-act/pdf/shingishinsa-guideline.pdf>

産業標準案作成対象テーマ一覧(制定)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号 (制定の場合は、仮の番号)	JIS案の名称	JIS案の英文名称	制定する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	制定	C5381-01	低圧サージ防護デバイス—第01部:一般要求事項及び試験方法	Low-voltage surge protective devices – Part 01: General Requirements and test methods	低圧サージ防護デバイスを規定しているIEC61643シリーズにおいて、数年前にドイツが統合した共通規格を提案し、サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法だけを統合した親規格のIEC61643-01が2024年に制定された。このため、これらのIECに対応するJISであるJIS C 5381規格群としても親規格となるJIS C 5381-01(予定)として制定し、規格の構成を合わせて整合を図る必要がある。また、この規格の利便性向上のため、JIS独自の附属書としてIEC/TR 61643-03の必要な箇条を追加規定する。	対応国際規格に沿った規定に整合化することによって、国内外における受渡当事者間での相互理解が容易になり、取引の円滑化、市場の拡大及び我が国の技術的な貿易障壁の未然防止が期待できる。また、我が国の製造業者の市場拡大につながることを期待できる。	<p>主な規定項目は、次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適用範囲 ・引用規格 ・用語、定義、略語及び記号 ・分類 ・表示及びほかの製品情報 ・使用条件 ・要求事項 ・試験 ・附属書 ルーチン試験及び受入試験 <p>・附属書 SPDの防護モードの統流の有無を決定する試験</p> <ul style="list-style-type: none"> ・附属書 温度上昇制限 ・附属書 屋外SPDの環境試験 ・附属書 短絡SPD ・附属書 SPDの防護モードの直列接続部の試験手順の簡素化 ・附属書 4.14.1.4に従ったSPDの試験手順 ・附属書 IEC61643-03(低電圧サージ防護デバイス-パート03)の規定においてJISに必要な箇条を追加 	—	IEC 61643-01:2024 Low-voltage surge protective devices – Part 01: General Requirements and test methods	MOD	第2条の該当号: 1(種類、性能)	法律の目的に適合している。	利点: イ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般社団法人電子情報技術産業協会のWG	2026年7月
JSA	06 電子	制定	C5381-41	低圧サージ防護デバイス—第41部:直流低電圧電力システムに接続するサージ防護デバイス(SPD)の要求事項及び試験方法	Low-voltage surge protective devices – Part 41: Surge protective devices connected to DC low-voltage power systems – Requirements and test methods	低圧サージ防護デバイスについて規定しているJIS C 5381規格群の対応国際規格であるIEC 61643シリーズのうち、直流用途である直流低電圧電力システムに接続するサージ防護デバイス(SPD)の要求事項及び試験方法を規定したIEC 61643-41が2025年に制定された。このため、JISにおいても同様な規格群の構成とし、国際規格と整合を図る必要がある。この規格は、JIS C 5381-01と共に用いる。	対応国際規格に沿った規定に整合化することによって、国内外における受渡当事者間での相互理解が容易になり、取引の単純公正化、国際貿易の円滑化及び我が国の技術的な貿易障壁の未然防止が期待できる。	<p>主な規定項目は、次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適用範囲 ・引用規格 ・用語、定義、図記号及び略語 ・分類 ・表示及びその他の製品情報 ・使用条件 ・要求事項 ・試験 ・附属書 SPDの試験電圧 ・附属書 直流電力システムのTOV試験値 	—	IEC 61643-41:2025 Low-voltage surge protective devices – Part 41: Surge protective devices connected to DC low-voltage power systems – Requirements and test methods	IDT	第2条の該当号: 1(種類、性能)	法律の目的に適合している。	利点: イ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般社団法人電子情報技術産業協会のWG	2026年7月

産業標準案作成対象テーマ一覧(制定)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号 (制定の場合は、仮の番号)	JIS案の名称	JIS案の英文名称	制定する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	制定	C61188-6-2	プリント配線板及びプリント配線板実装－第6－2部:ランドパターン設計:一般的な表面実装部品(SMD)	Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 6-2: Land pattern design - Description of land pattern for the most common surface mounted components (SMD)	近年、電子部品業界から新たな表面実装部品(SMD)の形状が次々に提案される状況の中、電子機器の設計製造業者が実装接合部の市場信頼性及び生産性を高度に保つには、国際規格に適合したランドパターン設計を行う必要が生じている。このような状況から、我が国の主導のもと、一般的なSMDを実装する回路基板のランドパターン設計について国際規格原案の審議がされ、2021年にIEC 61188-6-2として制定された。このため、我が国においても、この国際規格に整合したJISを制定する必要がある。	対応国際規格に沿った規定に整合化することによって、国内外における受渡当事者間での相互理解が容易になり、取引の単純公正化、国際貿易の円滑化及び我が国の技術的な貿易障壁の未然防止が期待できる。	主な規定項目は、次のとおり。 ・適用範囲 ・引用規格 ・用語及び定義 ・対象とするソルグリングプロセス ・ランドパターン設計の基本的考え方 ・要求事項	—	IEC 61188-6-2:2021 Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 6-2: Land pattern design - Description of land pattern for the most common surface mounted components (SMD)	IDT	第2条の該当号: 2(設計方法) 対象事項: プリント配線板	法律の目的に適合している。	利点: ウ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般社団法人電子情報技術産業協会のWG	2026年7月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	改正	C5101-14	電子機器用固定コンデンサ—第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデンサ(追補)	Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains	この規格は、直流1 000V以下、交流1 000 V(実効値)以下で、周波数100 Hz以下の交流電源又はその他の電源回路に接続することを目的とする電源用電磁障害防止固定コンデンサと抵抗器コンデンサとを組み合わせた部品の品種別通則について規定したもので、IEC 60384-14:2023を基に2024年に改正されたものである。その後、この規格の対応国際規格において、誘電正接の試験の適用範囲を明確にするなどのAmendment 1による改訂が2025年7月に行なわれたため、JISにおいても国際整合化及び技術の実態に対応させるためJISを追補改正する必要がある。	対応国際規格に沿った規定に整合化することによって、国内外における受渡当事者間での相互理解が容易になり、取引の単純公正化、国際貿易の円滑化及び我が国の技術的な貿易障壁の未然防止が期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 ・電氣的試験の誘電正接において、誘電正接測定試験の適用範囲を明確にするため、“この試験は、メタライズドコンデンサ及び磁器コンデンサだけに適用する。”を“この試験は、RCユニットには適用しない。”に改める。 ・誘電正接の測定試験の適用範囲を明確にするため、“一連耐候性—要求事項”、“高温高湿(定常)—電圧印加せずに試験した試料の要求事項”などの表の中の測定項目の表記の“誘電正接(tan δ)(メタライズドコンデンサの場合に適用)”を“誘電正接(tan δ)(メタライズドフィルムコンデンサ及び紙コンデンサの場合に適用)”へ改める。 ・品質評価手順のサンプリング計画の安全性を要求する試験の表などにおいて、受動燃焼性及び能動燃焼性では初期の電気測定は行わないことに合わせて、試験群0の試験項目の“定格電圧及びサブクラスごとの試料数”の欄に記載されている試験群6及び試験群7の試料数を削除する。	—	IEC 60384-14:2023+AMD1:2025 Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains + Amendment 1	IDT	第2条の該当号: 1(種類、品質、性能) 対象事項: 電子機器用固定コンデンサ	法律の目的に適合している。	利点: イ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般社団法人電子情報技術産業協会のWG	2026年7月
JSA	06 電子	改正	C5101-14-1	電子機器用固定コンデンサ—第14-1部:ブランク個別規格—電源用電磁障害防止固定コンデンサ—評価水準DZ	Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains	この規格は、JIS C 5101-14を品種別通則とするブランク個別規格で、電源用電磁障害防止用コンデンサの評価水準DZについて規定するもので、IEC 60384-14-1:2016を基に2020年に改正された規格である。JIS C 5101-14は、我が国の電気用品安全法省令の技術基準に採用された、電子機器の安全要求事項を規定するJIS[例:JIS C 62368-1(オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器—第1部安全性要求事項)]に引用されており、この規格は、JIS C 5101-14の補足の安全要求事項を規定した重要な規格である。 JIS C 5101-14の対応国際規格IEC 60384-14が2023年に改訂、2025年度に追補改訂され、高湿度条件下での使用に関する要求事項などが新たに追加された。それに整合させるために、この規格の対応国際規格IEC 60384-14-1が2025年に改訂された。このような状況から、対応国際規格との整合化及び親規格JIS C 5101-14にも整合させ、実態に即した内容とするため、この規格の改正を行う必要がある。	対応国際規格に沿った規定に整合化することによって、国内外における受渡当事者間での相互理解が容易になり、取引の単純公正化、国際貿易の円滑化及び我が国の技術的な貿易障壁の未然防止が期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 ・一般事項の寸法において、具体的な規定値が示されていない外形寸法の記号及び寸法の表を削除し、本文中に、寸法は許容差も含め製造業者の部品仕様書に規定する旨の要求事項を追加する。 ・交流定格安全認証のコンデンサを直流(DC)で用いる場合の要求事項(JIS C 5101-14の附属書H:サンプル数量が12個であることを追記)及び高湿度条件下の使用に関する要求事項(JIS C 5101-14の附属書I:誘電正接の要求対象に紙コンデンサを追加)を新たに規定する。	—	IEC 60384-14-1:2025 Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14-1: Blank detail specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains – Assessment level DZ	IDT	第2条の該当号: 1(種類、品質、性能) 対象事項: 電子機器用固定コンデンサ	法律の目的に適合している。	利点: イ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般社団法人電子情報技術産業協会のWG	2026年7月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	測定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	測定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	測定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	測定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	測定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会 (WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	改正	C5101-14-2	電子機器用固定コンデンサー第14-2部:ブランク個別規格-電源用電磁障害防止固定コンデンサー安全性試験	Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains	この規格は、JIS C 5101-14を品種別通則とするブランク個別規格で、電源用電磁障害防止固定コンデンサの安全性試験について規定するものでIEC 60384-14-2:2016を基に2020年に改正された規格である。JIS C 5101-14は、我が国の電気用品安全法省令の技術基準に採用された、電子機器の安全要求事項を規定するJIS[例:JIS C 62368-1(オーディオ・ビデオ、情報及び通信技術機器-第1部安全性要求事項)]に引用されており、この規格は、JIS C 5101-14の安全要求事項を規定した重要な規格である。評価水準によるブランク個別規格JIS C 5101-14-1とは別に、試験機関による認証が要求されている国での試験機関が適用する安全性を要求する試験だけについての試験計画を規定することによって、その利便性、国際的な安全性への相互理解及び経済性・貿易を考慮してこの規格は制定された。JIS C 5101-14の対応国際規格IEC 60384-14が2023年に改訂、2025年度に追補改訂され、高湿度条件下での使用に関する要求事項などが新たに追加された。それに整合させるために、この規格の対応国際規格IEC 60384-14-2が2025年に改訂された。このような状況から、対応国際規格との整合化及び親規格JIS C 5101-14にも整合させ、実態に即した内容とするため、この規格の改正を行う必要がある。	対応国際規格に沿った規定に整合化することによって、国内外における受渡当事者間での相互理解が容易になり、取引の単純公正化、国際貿易の円滑化及び我が国の技術的な貿易障壁の未然防止が期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 ・一般事項の寸法において、具体的な規定値が示されていない外形寸法の記号及び寸法の表を削除し、本文中に、寸法は許容差も含め製造業者の部品仕様書に規定する旨の要求事項を追加する。 ・交流定格安全認証のコンデンサを直流(DC)で用いる場合の要求事項(JIS C 5101-14の附属書H: サンプル数量が12個であることを追記)及び高湿度条件下での使用に関する要求事項(JIS C 5101-14の附属書I: 誘電正接の要求対象に紙コンデンサを追加)を新たに規定する。	—	IEC 60384-14-2:2025	IDT	第2条の該当号: 4(試験方法) 対象事項: 電子機器用固定コンデンサ	法律の目的に適合している。	利点: イ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般社団法人電子情報技術産業協会のWG	2026年7月
JSA	06 電子	改正	C5381-11	低圧サージ防護デバイス-第11部:交流低電圧電力システムに接続するサージ防護デバイス(SPD)の要求事項及び試験方法(現行名称:低圧サージ防護デバイス-第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法)	Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to AC low-voltage power systems - Requirements and test methods	この規格は、交流50/60 Hzの1000 V以下の電源回路及び機器に接続し、雷又はその他の過渡的過電圧の直接的及び間接的影響のサージに対する防護デバイスの要求性能、標準的な試験方法及び定格について規定したもので、IEC 61643-11:2011を基礎として2014年に制定された規格である。その後、この規格の対応国際規格のIEC 61643-11 (Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to AC low-voltage power systems - Requirements and test methods)が2025年に改訂され、全てのSPDに対する共通の要求事項及び試験方法を定めたIEC 61643-01 (Low-voltage surge protective devices - Part 01: General Requirements and test methods):2024の後続規格(relevant subsequent parts)となり、低圧配電システム用SPDだけに適用する規定を除き、用語、分類、表示を含む製品情報、使用条件、要求事項(電気的、機械的、環境・材料など)及び試験方法は、IEC 61643-01を引用するように改訂されるとともに、実態に対応させてタイプAプラグ接続形機器として可搬型SPDを追加するなどの改訂がされた。このような状況から、対応国際規格との整合を図るとともに実態に即した内容とするため、このJISを改正する必要がある。	対応国際規格に沿った規定に整合化することによって、国内外における受渡当事者間での相互理解が容易になり、取引の単純公正化、国際貿易の円滑化及び我が国の技術的な貿易障壁の未然防止が期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 ・規格全体として、JIS C 5381-01(同時に公示予定)に合わせた箇条構成に改める。 ・この規格(低圧配電システム用SPD)だけに適用する規定を除き、JIS C 5381-01の箇条・細分箇条を引用する表記に改める。 ・表示及びひまかの製品情報の箇条で、ユーザー及び試験機関向けに、製造業者が提供する表示などの情報を追加規定する。 ・新たな要求事項として、“タイプAプラグ接続形機器として規定する可搬型SPD”を追加するとともに、詳細事項を附属書として規定する。 ・現行のJIS C 5381-11に適合する低圧配電システム用SPDに対する縮小試験方法を附属書に規定する。 ・“タイプAプラグ接続形機器として規定する可搬型SPD”に関する詳細事項を附属書に規定する。	—	IEC 61643-11:2025	IDT	第2条の該当号: 1(種類、性能) 対象事項: サージ防護デバイス	法律の目的に適合している。	利点: イ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般社団法人電子情報技術産業協会のWG	2026年7月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	改正	C5381-21	低圧サージ防護デバイス第21部:通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイスの要求事項及び試験方法 (現行名称:低圧サージ防護デバイス-第21部:通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイス(SPD)の要求性能及び試験方法)	Low-voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Requirements and test methods (現行名称:LOW VOLTAGE SURGE PROTECTIVE DEVICES - Part21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods)	この規格は、雷又は一時的過電圧の直接及び間接的影響に対し、通信及び信号回線のサージ防護のためのデバイスの要求性能及び試験方法について規定したもので、IEC 61643-21:2009を基に2014年に改正された規格である。その後、この規格の対応国際規格は改訂され、全てのSPDに対する共通の要求事項及び試験方法を定めたIEC 61643-01 (Low-voltage surge protective devices - Part 01: General Requirements and test methods):2024の後続規格(relevant subsequent parts)となり、通信・信号用SPDだけに適用する規定を除き、用語、分類、表示を含む製品情報、使用条件、要求事項及び試験方法(電気的、機械的、環境・材料など)は、IEC 61643-01を引用し、100Wを超える通信・信号線に接続するSPDに対する安全要求事項と試験方法の追加など、多くの変更が行われた。このような状況から、対応国際規格と整合させ、最新の技術を取り込んだ内容に改正するため、JISを改正する必要がある。	対応国際規格に沿った規定に整合化することによって、国内外における受渡当事者間での相互理解が容易になり、取引の単純公正化、国際貿易の円滑化及び我が国の技術的な貿易障壁の未然防止が期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 ・規格全体として、JIS C 5381-01 (制定予定)に合わせた箇条構成に改める。 ・この規格(通信・信号用SPD)だけに適用する規定を除き、JIS C 5381-01の箇条・細分箇条を引用する表記に改める。 ・適用範囲において、パワーオーバーイーサネット(PoE)など同じ回線で電力を供給する場合も適用範囲に含むことを明記する。 ・表示及びほかの製品情報の箇条で、ユーザー及び試験機関向けに、製造業者が提供する表示などの情報を追加規定する。 ・新たな要求事項として、感電保護、機械的要求事項、環境及び材料の要求事項、並びに100Wを超える通信・信号線に接続するSPDに対する安全要求事項を追加する。 ・試験の箇条において、感電保護、機械的試験、環境及び材料の試験、100Wを超える通信・信号線に接続するSPDに対する安全試験を追加し、電気的試験については、伝送試験を除き、防護モード毎での試験に改める。 ・現行のJIS C 5381-21に適合する通信・信号用SPDに対する縮小試験方法を附属書に規定する。	—	IEC 61643-21:2025 Low-voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Requirements and test methods	IDT	第2条の該当号: 1(種類、性能) 対象事項: サージ防護デバイス	法律の目的に適合している。	利点: イ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般社団法人電子情報技術産業協会のWG	2026年7月
JSA	06 電子	改正	C5900	光伝送用受動部品通則	Generic specification of fiber optic passive devices	この規格は、石英系光ファイバを用いた光伝送に使用する光受動部品の通則であり、光伝送用受動部品の用語、定格などの一般的な共通事項について規定している。1987年に制定された後、5回の改正が行われ、2019年に最後の改正が行われた。一方、関連するIEC規格では、光伝送用受動部品の用語について、IEC/TS 62627-09:2016 (Fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 09: Vocabulary for passive optical devices)に記載されている。2025年12月8日に、IEC/TS 62627-09/AMD1 Ed.1が発行され、チューナブル(可変)光フィルタに関する一つの用語の定義が変更され、“固定光フィルタ”など、二つの用語及び定義が追加された。チューナブル光フィルタは、光増幅器など多くの光ファイバ通信システム及びサブシステムに用いられており、国内においても、多く製造され、使用されているものである。 このような状況から、チューナブル光フィルタに関する用語及び定義について、国際市場の拡大、技術の実態に即した規定内容とするため、JISを改正する必要がある。	今回の改正によって、国内外の市場における混乱を防ぎ、特に中規模企業が多い光減衰器の国内製造業者の活性化が図られるとともに、光減衰器の国内外における商取引がより円滑になり、国際貿易の円滑化が期待される。	主な改正点は、次のとおり。 ・用語及び定義において、“光フィルタ”の用語の定義の注釈1を、実態に即して“光フィルタには固定光フィルタと可変光フィルタがある”に改める。さらに注釈2として“信号光を透過する波長範囲を通過帯域、パスバンドという。複数のパスバンドがあってもよい。”を追加する。 ・用語及び定義において、対応国際規格に盛り込まれたため、“固定光フィルタ”及び“可変光フィルタ”の用語及び定義を追加する。	—	IEC/TS 62627-09:2016 + AMD1: 2025 CSV Fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 09: Vocabulary for passive optical devices	MOD	第2条の該当号: 1(用語及び定義、種類、寸法、構造、品質、性能) 対象事項: 光伝送用受動部品	法律の目的に適合している。	利点: キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2026年7月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	改正	C60068-2-42	環境試験方法—電気・電子—第2-42部:接点及び接続部の二酸化硫黄試験方法(試験記号:Kc) (現行名称:環境試験方法—電気・電子—接点及び接続部の二酸化硫黄試験方法)	Environmental testing - Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections	この規格は、二酸化硫黄で汚染された大気が、電気・電子技術の部品、機器の接点及び接続部に及ぼす腐食効果を評価するための加速的試験方法について規定したもので、1993年にIEC 60068-2-42:1982を基に制定された。対応国際規格のIEC 60068-2-42は、2003年に初期測定及び最終試験における接触抵抗の測定方法を近年の技術に即した方法に改めるなどの改訂が行われた。このような状況から、国際規格との整合及び技術の実態に即したものとするため、JISを改正する必要がある。	対応国際規格に沿った規定に整合化することによって、国内外における受渡当事者間での相互理解が容易になり、取引の単純公正化、国際貿易の円滑化及び我が国の技術的な貿易障壁の未然防止が期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 ・初期測定及び最終試験において、接触抵抗の測定を、対応国際規格に整合させ、“低電圧低電流法”から、“ミリボルトレベル法”に改める。	—	IEC 60068-2-42:2003 Environmental testing - Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections	IDT	第2条の該当号: 4(試験方法) 対象事項: 電気・電子部品	法律の目的に適合している。	利点: イ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般社団法人電子情報技術産業協会のWG	2026年7月
JSA	06 電子	改正	C60068-2-83	環境試験方法—電気・電子—第2-83部:試験Tf—ソルダペーストを用いた平衡法による表面実装部品(SMD)のはんだ付け性試験方法	Environmental testing - Part 2-83: Tests - Test Tf: Solderability testing of electronic components for surface mounting devices (SMD) by the wetting balance method using solder paste	この規格は、ソルダペーストを用いた平衡法による表面実装部品(SMD)のはんだ付け性試験を規定したものであり、IEC 60068-2-83:2011に基づき制定されたものである。その後、基礎とした国際規格は、日本主導によって多岐にわたるSMDのはんだ付け性試験の前処理方法を実際の市場における倉庫保管に対応する内容に変更し、2025年5月に改訂された。このような状況から、対応国際規格とのギャップを解消すると共に、現在の市場の環境に即した内容にするために、JISを改正する必要がある。	対応国際規格に沿った規定に整合化することによって、国内外における受渡当事者間での相互理解が容易になり、取引の単純公正化、国際貿易の円滑化及び我が国の技術的な貿易障壁の未然防止が期待できる。	主な改正点は、次のとおり。 ・実倉庫保管に合わせた前処理条件に対応するため、JIS C 60068-2-20:2022で規定している保管環境をシミュレートした前処理方法に合致するように変更する。	—	IEC 60068-2-83:2025 Environmental testing - Part 2-83: Tests - Test Tf: Solderability testing of electronic components for surface mounting devices (SMD) by the wetting balance method using solder paste	IDT	第2条の該当号: 4(試験方法) 対象事項: 電気・電子部品	法律の目的に適合している。	利点: イ、キ 欠点: いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般社団法人電子情報技術産業協会のWG	2026年7月

産業標準案作成対象テーマ一覧(改正)

認定機関	産業標準作成委員会	制定/改正/廃止	規格番号	JIS案の名称	JIS案の英文名称	改正する理由(必要性)	期待効果	規定項目又は改正点	制定・改正に伴う廃止JIS	対応する国際規格番号及び名称	対応する国際規格との対応の程度	選定基準1 (JIS法第2条の産業標準化の対象)	選定基準2 (JIS法第1条の法律の目的)	選定基準3 (産業標準化の利点・欠点)	選定基準4 (国が主体的に取り組む分野の判断基準)	選定基準5 (市場適合性に関する判断基準)	JIS素案作成委員会(WG)	作成開始予定
JSA	06 電子	改正	C61300-2-22	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－第2－22部：試験－温度サイクル試験	Fiber optic interconnecting devices and passive components－Basic test and measurement procedures－Part 2－22: Tests－Change of Temperature	この規格は光ファイバ接続デバイス及び光受動部品の温度変化、又は温度変化の繰返しに対する耐久性を判定する手順について、IEC 61300-2-22:2007を基に2012年に制定されたものである。その後、対応国際規格では、最初に高温にする条件の削除、試験の厳しさをIEC 61753-1:2018 (Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1; General and guidance)と整合させるため、2024年に改訂された。 日本国内においても多く使用される製品にかかわるものであり、国際規格との整合を図るとともに技術の実態に即した試験方法とするため、改正を行う必要がある。	この改正によって、より多くの製品種類について、国内での測定結果をそのまま国際取引で使用可能となり、市場の混乱回避と、取引の円滑化が見込まれる。さらに、電気・電子機器に組み込んで使用することが容易になり、市場の拡大が期待される。	主な改正点は、次のとおり。 ・装置において、試験装置及び測定装置について、参照すべき規格として、JIS C 60529、JIS C 61300-2-38、JIS C 61300-3-1、JIS C 61300-3-3、JIS C 61300-3-4、及び JIS C 61300-3-6 を追加する。 ・手順において、試験条件について、大型の供試品では保持時間を長くし、試験中の測定は少なくとも各温度状態の最後で行うよう規定する。また、測定間隔は最大10分とするよう追加するとともに、最初に高温にする条件を削除する。 ・試験の厳しさを程度において、追加の熱源がある場合のカテゴリを追加するとともに、保持時間の推奨値を新たに規定する。	—	IEC 61300-2-22:2024 Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2 –22: Tests – Change of temperature	MOD	第2条の該当号：4(試験方法) 対象事項：光受動部品	法律の目的に適合している。	利点： キ 欠点： いずれも該当しない。	—	国際標準をJIS化するもの	一般財団法人光産業技術振興協会のWG	2026年7月